

## IEEE SWTW 2012 年度 Best Overall Presentation Award を受賞

日本電子材料株式会社（本社：兵庫県尼崎市 社長：風間悦男）は、このたび、IEEE SWTW（Semiconductor Wafer Test Workshop）に株式会社アドバンテスト（本社：東京都千代田区 社長：松野晴夫）と共同発表した論文で、2012 年度「Best Overall Presentation Award」を受賞いたしました。

「Best Overall Presentation Award」とは、SWTW で発表されたすべての論文の中から最も優秀な論文 1 件に贈られる賞です。本年は全 29 件の発表論文の中から、「Full Wafer Contact Breakthrough with Ultra High Pin Count（減圧によるコンタクト推力発生方式を用いたウェハ一括試験技術の開発成果）」がこの名誉ある Award を受賞いたしました。

本論文は株式会社アドバンテスト（半導体試験装置メーカー）と当社（プローブカードメーカー）とが共同で開発した、ウェハ一括コンタクト試験技術を紹介したものです。減圧コンタクト方式と既存 MEMS コンタクトを用いて、将来の 450mm ウェハや超多ピンプロービングにおいてもウェハ一括コンタクトが可能となるものです。超多ピンプロービングにおけるコスト、信頼性に対する不安を払拭するアイデアとして、Flash メモリや DRAM だけでなく、マイコン、SOC などさまざまな分野への応用が可能となるコンセプトであり、今後普及が見込まれる 2.5D/3D IC といった分野にも適用が期待されます。

当社はこの受賞を機に、今回のコンセプトを実商品へと展開・応用すべく顧客の意見を取り入れながらブラッシュアップしていきます。

SWTW（Semiconductor Wafer Test Workshop）は、IEEE のコンピューター専門部会が後援するウェハテストに関する唯一の研究討論会で、今年で 22 年目を迎えます。各国よりメーカーやサプライヤーが参加し、産業発展のための技術情報交換を行っています。

また、IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.）は、世界 160 ヶ国、40 万以上の個人会員を持つ非営利の電気・電子技術者の組織で、国際会議の開催、論文誌の発行、技術教育、規格化などの活動を行っています。